




01. 공동장비운영센터 전자현미경분석실/전계방사형주사전자현미경/에너지분산형 분광기/전자후방산란회절기

장비내역 (메인장비 B)	국문	전계방사형주사전자현미경/에너지분산형 분광기/전자후방산란회절기
	영문	Field Emission Scanning Electron Microscope /Energy Dispersive Spectrometer/Electron Backscatter Diffraction
	모델명	S-4800/ ISIS310/ C960593
	제작사	Hitachi (FE-SEM) / HORIBA/Hitachi (BSE)
	관리부서	공동장비운영센터 전자현미경분석실
	배치현황	공대2호관 전자현미경분석실 1213호
	장비상태	정상
	기자재번호	200512000006
		
응용 및 용도	<ul style="list-style-type: none"> - 금속, 고분자, 세라믹 등 재료의 표면 및 박막두께 관찰 - 바이러스, 박테리아 등 생물시료 조직의 형태관찰 - 후방산란전자를 이용한 compo/topo 이미지 분석 - 제품의 기계적 결함 등 고장분석 - 특성 X-선을 이용한 재료의 화학성분을 정성, 정량분석 - EDS 성분분석 및 원소별 Mapping 분석 - BSE 성분분석 및 원소별 Mapping 분석 	
분석료	<ul style="list-style-type: none"> - FE-SEM 기본료(예약취소시만 적용) : 30,000원 1시간 :30,000원 이미지/10장 : 15,000원 Yag-BSE 이미지/10장 : 30,000원 시료/개 :15,000원 코팅/1회 : 10,000원 -EDX 정성분석(면,점)/1회 : 10,000원 Mapping/1회 : 20,000원 Linescan/1회 :20,000원 -Mapping, Linescan 1회 당 15분 추가시 : 20,000원 	
기타		


02. 공동장비운영센터 전자현미경분석실/주사전자현미경

장비내역	국문	전계방사형주사전자현미경/에너지분산형 분광기/전자후방산란회절기
	영문	Field Emission Scanning Electron Microscope /Energy Dispersive Spectrometer/Electron Backscatter Diffraction
	모델명	S-4800/ ISIS310/ C960593
	제작사	Hitachi (FE-SEM) / HORIBA/Hitachi (BSE)
	관리부서	공동장비운영센터 전자현미경분석실
	배치현황	공대2호관 전자현미경분석실 1213호
	장비상태	정상
	기자재번호	200512000006
		
응용 및 용도	<ul style="list-style-type: none"> - 금속, 고분자, 세라믹 등 재료의 표면 및 박막두께 관찰 - 바이러스, 박테리아 등 생물시료 조직의 형태관찰 - 후방산란전자를 이용한 compo/topo 이미지 분석 - 제품의 기계적 결함 등 고장분석 - 특성 X-선을 이용한 재료의 화학성분을 정성, 정량분석 - EDS 성분분석 및 원소별 Mapping 분석 - BSE 성분분석 및 원소별 Mapping 분석 	
분석료	<p>1시간 : 30,000원 코팅/1회 : 10,000원</p>	
기타		


03. 공동장비운영센터 전자현미경분석실/탁상용주사전자현미경

장 비 내 역	국 문	탁상용주사전자현미경
	영 문	Field Emission Scanning Electron Microscope /Energy Dispersive Spectrometer/Electron Backscatter Diffraction
	모 델 명	S-4800/ ISIS310/ C960593
	제 작 사	Hitachi (FE-SEM) / HORIBA/Hitachi (BSE)
	관 리 부 서	공동장비운영센터 전자현미경분석실
	배 치 현 황	공대2호관 전자현미경분석실 1213호
	장 비 상 태	정상
	기 자 재 번 호	200512000006
		
응 용 및 용 도	<ul style="list-style-type: none"> - 금속, 고분자, 세라믹 등 재료의 표면 및 박막두께 관찰 - 바이러스, 박테리아 등 생물시료 조직의 형태관찰 - 후방산란전자를 이용한 compo/topo 이미지 분석 - 제품의 기계적 결함 등 고장분석 - 특성 X-선을 이용한 재료의 화학성분을 정성, 정량분석 - EDS 성분분석 및 원소별 Mapping 분석 - BSE 성분분석 및 원소별 Mapping 분석 	
분 석 료	<p>1시간 : 20,000원 코팅/1회 : 10,000원</p>	
기 타		


06. 공동장비운영센터 물성전처리 실험실/마운팅프레스

장비내역	국문	마운팅프레스	
	영문	Hot mounting press	
	모델명	RB 217 LUXPRESS-I	
	제작사	제이앤씨싸이언스	
	관리부서	공동장비운영센터 물성전처리 실험실	
	배치현황	공동장비 1226호 X-선분석실	
	장비상태	정상	
	기자재번호	202212000039	
			
응용 및 용도	시편제작		
분석료	일반 핫마운팅/1회	실비 청구	
	전도성 마운팅/1회	실비 청구	
	기타 마운팅/1회	실비 청구	
기타			

06. 공동장비운영센터 물성전처리 실험실/연마기

장 비 내 역	국 문	2구 수동 연마기	
	영 문	polisher	
	모 델 명	FOBOS-200F	
	제 작 사	(주)지에스이엠	
	관리부서	공동장비운영센터 물성전처리 실험실	
	배치현황	공동장비_1226호 X-선분석실	
	장비상태	정상	
	기자재번호	202210000083	
			
응용 및 용도	<ul style="list-style-type: none"> - 금속 및 자원시료 연마시 폴리셔를 이용하여 시료 전처리에 기여 - 분석기기(미세구조 및 결정구조) 재료 물성 시료 전처리에 해당됨 		
분 석 료	일반연마/1회	실비 청구	
	미세연마/1회		
기 타			

08. 공동장비운영센터 의대전자현미경실/투과전자현미경

장비내역	국문	투과전자현미경
	영문	Transmission Electron Microscope
	모델명	H-7600
	제작사	Hitachi
	관리부서	공동장비운영센터
	배치현황	의과대학 2호관 1203호 전자현미경분석실
	장비상태	유휴
	기자재번호	200210000107
		
응용 및 용도	- 의학, 생물학등 자연과학분야와 공학계열의 미세구조의 형태학적 관찰	
분석료	- 관찰 및 촬영 : 시간당 150,000원	
기타 사항		

09. 공동장비운영센터 의대전자현미경실/초박절기

장비내역	국문	초박절기
	영문	Ultramicrotome
	모델명	MT-7000
	제작사	RMC U.S.A
	관리부서	공동장비운영센터
	배치현황	의과대학 2호관 1203호 전자현미경분석실
	장비상태	유휴
	기자재번호	199905000002



응용 및 용도	- 투과전자현미경 관찰을 위한 초박절기기(nm)
분석료	- Thin section : 기본 2 block : 50,000원 - 추가 1 block 당 : 20,000원 - 전처리 : 2sample : 60,000원 - 추가 1sample 당 : 30,000원
기타 사항	- Diamond knife 사용


10. 공동장비운영센터 원자분광분석실/총유기탄소분석기

장 비 내 역	국 문	총유기탄소분석기
	영 문	Total Organic Carbon Analyzer
	모 델 명	TOC-Vcph
	제 작 사	Shimadzu, JAPAN
	관리부서	공동장비운영센터 원자분광분석실 해양생물교육연구센터 이전장비
	배치현황	공대2호관 원자분광분석실 1208호
	장비상태	양호
	기자재번호	200805000045



응용 및 용도	<ul style="list-style-type: none"> - 지질 분야 : 지하수 중의 유기탄소양 측정 - 해양 분야 : 해수 중의 유기탄소양 측정 - 환경 분야 : 유기오염물 지표로서 음용수 및 하천수의 유기탄소양 측정 												
분 석 료	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td rowspan="2">Liquid</td> <td>기본(건)</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td>추가(1시료)</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Solid</td> <td>기본(건)</td> <td>20,000</td> </tr> <tr> <td>추가(1시료)</td> <td>20,000</td> </tr> </table>	Liquid	기본(건)	10,000	추가(1시료)	10,000	Solid	기본(건)	20,000	추가(1시료)	20,000	6	
Liquid	기본(건)		10,000										
	추가(1시료)	10,000											
Solid	기본(건)	20,000											
	추가(1시료)	20,000											
기 타	<ul style="list-style-type: none"> - 교내 실험실습지원 - 엔지니어 양성사업 실험실습 교육 												

11. 공동장비운영센터 원자분광분석실/유도결합플라즈마 분광분석기

장비내역	국문	유도결합플라즈마 분광분석기	
	영문	ICP-OES (Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometer)	
	모델명	Optima 5300 DV	
	제작사	Perkinelmer, USA	
	관리부서	공동장비운영센터 원자분광분석실	
	배치현황	공대2호관 원자분광분석실 1208호	
	장비상태	양호	
	기자재번호	200803000037	
			
응용 및 용도	<ul style="list-style-type: none"> - 용액 상태의 주성분 원소, 미량원소의 분석 - 수질오염에 따른 중금속 원소 분석 - 생체, 생물 시료의 중금속 원소 분석 - 환경, 화학시료의 무기원소 분석 - 금속, 광물, 암석시료의 무기원소 분석 - 식품 및 토양시료의 무기원소 분석 		
분 석 료	기본(건)		30,000
	추가(5원소/시료)		10,000
	추가원소		2,000
	필터링		3,000
	재측정		50%
	직접 사용자	기본(건)	30,000
		추가(1시간)	30,000
기 타	<ul style="list-style-type: none"> - 교내 실험실습지원 - 엔지니어 양성사업 실험실습 교육 		

12. 공동장비운영센터 원자분광분석실 /수은분석기

장비내역 (메인장비 B)	국문	수은분석기
	영문	Mercury Analyzer
	모델명	MA-2
	제작사	NIC, JAPAN
	관리부서	공동장비운영센터 원자분광분석실
	배치현황	공대2호관 원자분광분석실 1208호
	장비상태	정상
	기자재번호	200601000040



응용 및 용도	- 의학, 약학, 금속, 식품, 농의학, 지질, 해양, 환경, 원자력, 화학, 반도체분야 등에서 극미량 수은 분석		
분 석 료	기본(건)	20,000	
	첨가제 사용 추가(1시료)	12,000	
	첨가제 미사용 추가(1시료)	6,000	
	직접사용자	기본(건)	20,000
		추가(시간)	20,000
기 타	- 교내 실험실습지원 - 엔지니어 양성사업 실험실습 교육		